Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/660,296	KEENE ET AL.	
Examiner	Art Unit	
HUNG Q. PHAM	2168	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
707	2,9,10	7/20/2006	HP
	,		

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
	!		
<u></u>			
	L		
			_

SEAR((INCLUDING SE	CH NOTES EARCH STRATEG	Y)
	DATE	EXMR
EAST SEARCH	7/20/2006	НР
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		